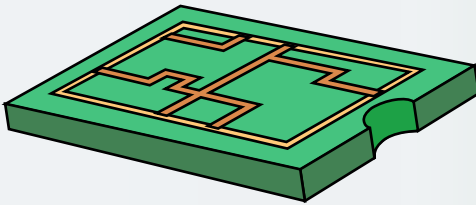
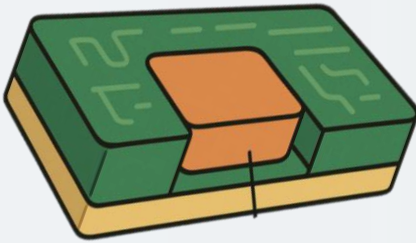


LCR (Inductance/capacitor/resistance)
COMPONENT EMBEDDED



PCB
OPEN/SHORT INSPECTION



POWER DEVICE
Semiconductor Embedded



3TESTERS IN 1SYSTEM

31E21EK2 IN J2A21EW

High-Accuracy & High-Speed Testing
满足高精度多组电感同时测试的需求，通过精密的机械移动保证高速测试，适用于量产场景。

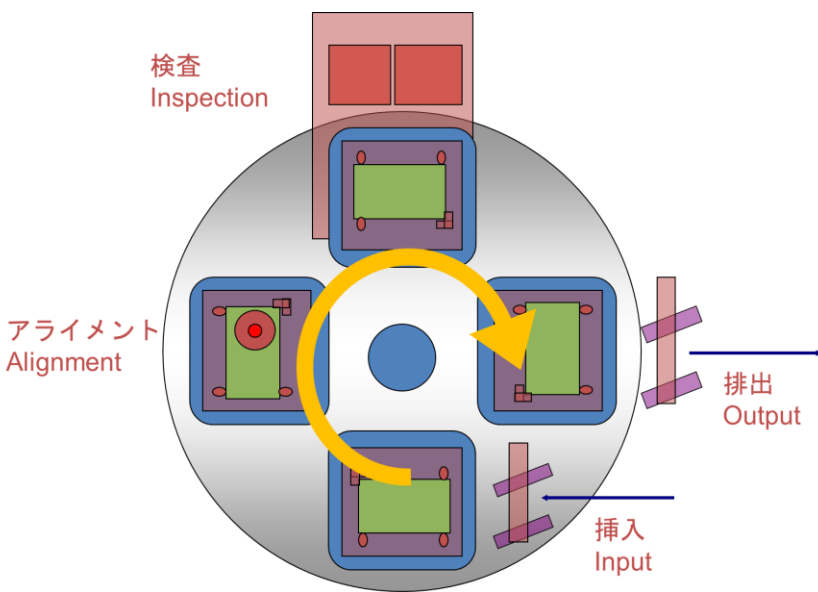
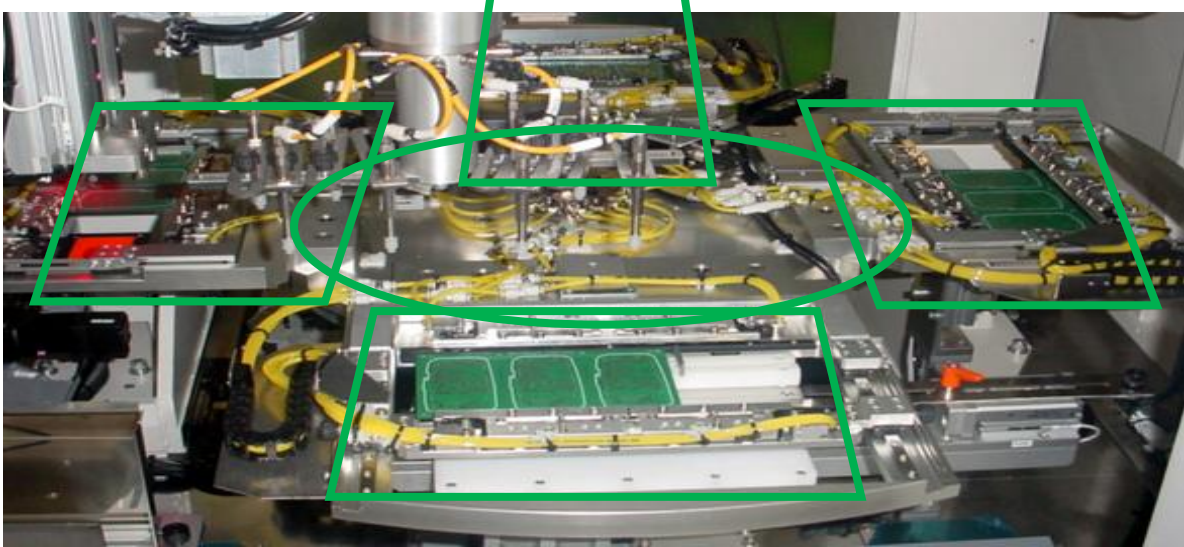
Supports Various PCB Form Factors
可容纳各种PCB尺寸、厚度和形状。可定制的夹具和探头设计，适用于各种应用。

High-Voltage & High-Current Testing
支持高达3000V的电压和高达2000A的电流，能够准确评估关键功率器件参数，如阈值，漏电流，耐压性测试。

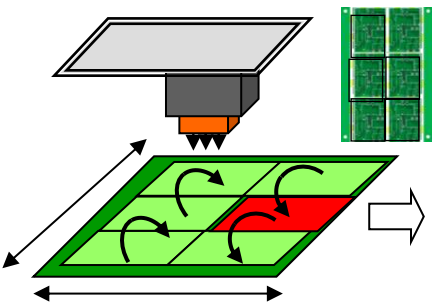
该检测系统专为电感埋入基板，以及嵌入SiC和IGBT等功率半导体器件的PCB，提供高精度、高可靠性的测试而设计。该系统支持高精度多组电感同时测试，以及高压和漏电流检测，非常适合需要严格质量保证的应用。

Comprehensive alignment accuracy $\pm 7.5\mu\text{m}$

High-Speed Inspection

▲ Rotary table type



运用X、Y 分步&重复式构造进行高效的检测

※根据产品的排布，可能存在无法使用此功能的情况。

System Inspection

Tester Specifications	
电感 Test Items	Description
Inductance Components	Guard Scanner pin 192ch (max)
Test Frequency	100kHz ~ 1MHz
Input voltage	0.1Vrms ~ 2Vrms
Accuracy	$\pm 5\% \pm 0.1\text{nH}$ (范围1nH ~ 100nH时)
PCB Test Items	Description
导通 (OPEN)	1 Ω ~ 100k Ω (DC1V ~ 250V)
短路 (LEAK)	判定阻值: 10k Ω ~1G Ω ; 施加电压: 10V ~ 250V
Test Point	D/D 4096pins (U2048 + L2048p) max 8192pins
DC Test Items	Description
Short check & Contact check	识别短路与连接缺陷
Leakage Current(IGSS&IDSS)	检测低至几nA的漏电流 (施加高达3000V的电压)
Vce(sat), Vgs(th), Rds(on)	阈值与状态测量
BRVdss	击穿电压检查

Items	Description
电路板尺寸/厚度	尺寸: 最小W50×D50mm(特殊: 最小W45×D50mm), 最大W420mm×D380mm 厚度: 标准1mm~4mm (特殊1mm~5mm)
基板装载高度	H: 300mm (MAX)
上下载(隔纸)	上料部分: 上料槽+隔纸槽, 下料部分: 标配3个槽+隔纸槽
检测构造	由4旋转台形成的分步&重复式构造 (Index)
对位 / 精度	双面CCD自动定位 /重复精度 $\pm 5.0\mu\text{m}$ /综合对位精度 $\pm 7.5\mu\text{m}$
治具交换	一键取出
设备选配	2Dcode 读取、测试数据上传, 连续缺陷报警, laser marking